

2019年度 後期 いわて半導体アカデミー公開講座

第4回

11月1日 14:55~16:35

受講
無料

『半導体の信頼性と最近の話題』

講師：塩野 登様

(一般財団法人 日本電子部品信頼性センター 理事長)

◆概要

半導体の信頼性の基本概念、故障率と使用時間の関係（バスタブカーブ）、高信頼化設計手法、及び最近の半導体開発状況と信頼性について、具体的事例を交えて解説する。

事例は、LEDランプの寿命載用電子制御ユニット（ECU）用プロセッサLSIの高信頼化、SiCパワーデバイスの信頼性、最新LSI（Fin、車 FET）の信頼性等である。

◆内容

1. 信頼性工学の歴史
2. 信頼性を表す指標（用語）、基本関数
3. 故障率の時間依存性（バスタブカーブ）
4. 電子機器の故障率予測方法と例
5. 高信頼性設計（冗長設計）と例
6. 最近の半導体の開発状況と信頼性
7. まとめ

場 所

岩手大学 理工学部 銀河ホール

https://www.iwate-u.ac.jp/upload/images/campus_map_1.jpg

申込方法

下記申込先に電子メール、またはお電話にてお申込み下さい。
随時申込受け付けます。

◆花巻サテライト協賛事業◆

お申込み
お問合せ

岩手大学 ものづくり技術研究センター
いわて半導体アカデミー事務局

TEL: 0198-41-4785 FAX: 0198-41-4786

E-mail: isemicon@iwate-u.ac.jp

ホームページ: <http://isemicon.iwate-u.ac.jp/>

QRコードで簡単アクセス!

